2010. Том 51, № 5

Сентябрь – октябрь

C. 896 – 902

УДК 544.236.2:543.429.23

ИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ И СТРОЕНИЕ СТЕКОЛ В СИСТЕМАХ ZrF_4 — BiF_3 — MF_2 (M = Sr, Ba, Pb) ПО ДАННЫМ ЯМР, ИК И КР СПЕКТРОСКОПИИ

© 2010 В.Я. Кавун*, А.Б. Слободюк, Е.И. Войт, С.Л. Синебрюхов, Е.Б. Меркулов, В.К. Гончарук

Институт химии ДВО РАН, Владивосток

Статья поступила 14 июля 2009 г.

Методами ЯМР (¹⁹F), ИК и КР спектроскопии (включая MAS ЯМР ¹⁹F) изучена ионная подвижность и строение ряда новых стекол в системах ZrF_4 —BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb) в диапазоне температур 180—500 К. Интервал температур, в котором доминирующей формой ионных движений становится диффузия ионов фтора, определяется природой катиона M²⁺. Рассмотрены факторы, определяющие базовую модель строения стекол в системах ZrF_4 —BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb) и условия, при которых возможно участие полиэдров висмута в построении сетки стекла. По данным импедансной спектроскопии исследованные стекла обладают сравнительно высокой ионной проводимостью ($\sigma \ge 10^{-4}$ См/см выше 480 K).

Ключевые слова: фториды циркония, висмута, бария, свинца, стронция, фтороцирконатные стекла, спектры ЯМР¹⁹F, ИК и КР, ионная подвижность и проводимость, строение.

Поиск новых стекол, обладающих приемлемыми для практических целей оптическими, электрофизическими и другими свойствами, является актуальной задачей проводимых в настоящее время исследований. Одно из направлений этих исследований — изучение фторионной проводимости, поскольку на основе фторидных стекол возможно получение твердых электролитов для химических источников тока, сенсорных и других материалов. Стеклообразное состояние характеризуется определенным видом структурной разупорядоченности в аморфных телах, в результате которой в ряде неорганических систем получены стекла с высокой ионной проводимостью (до 10⁻²—10⁻⁴ См/см) [1—3]. В силу ряда причин особое место занимают фтороцирконатные стекла (в том числе и с добавками трифторида висмута), многочисленные исследования которых связаны с поиском новых составов и установлением критериев их образования [3-7]. В качестве примера можно привести последние исследования нового класса соединений — висмутфтороцирконатных стекол с добавками фторидов щелочных металлов [8, 9]. Более ранние исследования [10, 11] позволили оценить влияние трифторида висмута на структуру и свойства стекол в системе InF_3 —BaF₂—BiF₃ и показать, что величина ионной проводимости в стекле 30InF₃—35BaF₂—35BiF₃ находится на уровне лучших показателей для фторидных стекол, известных на то время в литературе: $\sigma = 1.4 \times 10^{-4}$ См/см (440 K) [3].

В данном сообщении обсуждаются результаты исследования ионной подвижности и строения новых висмутфтороцирконатных стекол (ВФЦС) в системах ZrF_4 —BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb) с целью поиска стекол с определенными функциональными свойствами.

^{*} E-mail: kavun@ich.dvo.ru

Характеристические температуры (T, K) и характеристики ионной проводимости ВФЦС в системах ZrF₄—BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb)

Состав шихты, мол. %	$T_{\rm g}$	T_x	$T_{\rm c}$	$E_{\rm a}$, эВ	σ, См/см
457-E 25D:E 208-E (I)	510	570	570	0.66 + 0.01	$1.2.10^{-4}$ (402 K)
$432\Gamma_4 - 33D\Gamma_3 - 205\Gamma_2$ (1)	318	312	3/9	$0,66 \pm 0,01$	$1,2\times10$ (493 K)
$45ZrF_4$ — $35BiF_3$ — $20BaF_2$ (II)	520	607	634	$0,\!66\pm0,\!02$	1,7×10 ⁻⁴ (493 K)
$45ZrF_4$ — $35BiF_3$ — $20PbF_2$ (III)	493	561	567	$0,\!65\pm0,\!01$	4,0×10 ⁻⁴ (492 K)
$50ZrF_4$ — $40BiF_3$ — $10BaF_2$ (IV)	512	574	579	$0,\!63\pm0,\!01$	6,7×10 ⁻⁵ (492 K)
$50ZrF_4$ — $20BiF_3$ — $30BaF_2$ (V)	538	617	632	$0{,}62\pm0{,}01$	4,3×10 ^{−5} (493 K)
$50ZrF_4$ —10BiF ₃ —40BaF ₂ (VI)	561	605	625	$0,\!65\pm0,\!02$	9,2×10 ⁻⁵ (493 K)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика получения стекол в системах ZrF_4 —BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb) описана ранее [12, 13]. Состав исследуемых ВФЦС, температура размягчения T_g , начала кристаллизации T_x и максимума пика кристаллизации T_c для рассматриваемых стекол представлены в таблице. Термические свойства стекол I—VI изучали на дифференциальном сканирующем калориметре (DSC-204-F1 NETZCH) с использованием методики определения характеристических температур, приведенной в [13].

Спектры ЯМР ¹⁹F записывали на спектрометрах фирмы БРУКЕР SWL 3-100 (84,66 МГц) и AV-300 (282,404 МГц — ¹⁹F) в диапазоне температур 180—500 К. Методики измерения второго момента S_2 спектров ЯМР (в Гс²), ширины линии ΔH на половине высоты (в кГц) и химического сдвига (ХС), δ (в м.д. относительно жидкого эталона C₆F₆ с точностью до 2 %) описаны в работах [9, 10]. Здесь же выполнена оценка энергии активации E_a локальных движений ионов при использовании формулы Уо—Федина [14] (в кДж/моль с ошибкой не более ±3 кДж/моль) и интегральной интенсивности узкой и широких компонент спектров ЯМР ¹⁹F (с точностью до 5 %), отвечающих подвижным ($v_c > 10^4$ Гц, v_c — частота корреляции [14]) и "неподвижным" ($v_c \le 10^4$ Гц) ионам F⁻.

КР спектры образцов регистрировали на спектрометре TRiVista 777 (лазер Ar: v = 4880 и 5145 Å, W = 200 мВт) под углом рассеяния 90° с разрешением 2 см⁻¹. Спектры снимали с тонких стекольных пластинок и мелкодисперсных образцов для кристаллических объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Типичные спектры ЯМР ¹⁹F исследуемых стекол при разных температурах представлены на рис. 1. Трансформация спектров при вариации температу- ¹⁹F $452rF_4-35BiF_3-20MF_2$

на рис. 1. Грансформация спектров при вариации температуры обусловлена изменением динамического состояния резонирующих ядер группировок циркония (висмута), формирующих сетку стекла. При T < 250 К спектры ЯМР стекол с разными двухвалентными катионами состоят, как минимум, из двух линий с химическим сдвигом (200 ± 10) и ($70\pm$ ±20) м.д. (см. рис. 1). Второй момент спектров ЯМР ¹⁹F в магнитных полях 21,14 и ~70,5 кГс существенно различается по величине, что может быть связано с вкладом анизотропии ХС в форму спектра при низких температурах [14— 17]. Форма линии и значения S_2 спектров ЯМР ¹⁹F (11,5— 12,5 Гс² в области температур 200—250 К в магнитном поле 21,14 кГс) позволяют предположить, что при температуре



Puc. 1. Спектры ЯМР ¹⁹F стекол 45 ZrF₄—35 BiF₃—20 MF₂ при изменении температуры ниже 250 К во фторидной подсистеме отсутствуют ионные движения с частотой выше 10⁴ Гц ("жесткая решетка" в терминах ЯМР [14]).

Появление в спектрах ЯМР ¹⁹F стекол 45ZrF₄—35BiF₃—20MF₂ при T > 290, 310 и 330 K (Pb → Ba → Sr) "узкой" компоненты с XC ≈ 165 м.д. (Ba, Pb) и 150 м.д. (Sr) (см. рис. 1) связано с переходом части фторидной подсистемы от жесткой решетки к локальным движениям. Анализ температурной зависимости формы линии и ширины спектра ΔH показывает, что низший интервал температур, в котором развивается этот процесс, характерен для стекла III ($E_a \approx$ ≈ 46 кДж/моль), имеющего более низкое значение T_g по сравнению с другими аналогичными по составу стеклами (см. таблицу). По мере повышения температуры интенсивность узкой компоненты растет (с одновременным ее сужением), а широких линий уменьшается, что свидетельствует об увеличении числа высокоподвижных фторсодержащих группировок в стекле. Число мобильных ионов фтора при 450 K выше в стекле, содержащем ионы свинца (≈ 75 %), по сравнению со стеклами II и I (≈ 65 и 60 % соответственно). Учитывая форму линий, значения второго момента и ширину компонент в спектрах ЯМР ¹⁹F, можно полагать, что локальные движения (наряду с жесткой решеткой) остаются основным видом движений ионов во фторидной подрешетке для стекол с любым катионом M^{2+} в области температур 350—450 К. В диапазоне 450—500 К во фторидной подрешетке стекол І—ІІІ появляется диффузия, о чем свидетельствуют данные ЯМР ¹⁹ F. В частности, спектр ЯМР ¹⁹ F стекла, содержащего ионы свинца, при 500 К состоит из практически одиночной лоренцевой линии ($\delta \approx 165$ м.д.) с шириной ≈ 6.8 кГц и вторым моментом менее 2 Γc^2 ($B_0 = 7.05$ T). При тех же условиях в спектре ЯМР "бариевого" стекла 96 % площади спектра занимает узкая компонента лоренцевой формы с $\delta = 160$ м.д. и $\Delta H \approx 10,5$ кГц. Необходимо отметить, что результаты многочисленных исследований ионной подвижности во фторсодержащих системах показывают, что ширина резонансной линии, отвечающей трансляционной диффузии ионов фтора, лежит, как правило, в диапазоне 1000-4000 Гц, а величина второго момента обычно меньше 0,1 Гс² [14-17]. В нашем случае для стекол I—III ширина линии при данной температуре зависит от природы катиона M^{2+} , а сравнительно большие ΔH при наличии диффузии во фторидной подрешетке, по-видимому, связаны с неполным усреднением диполь-дипольных взаимодействий магнитных ядер. В пользу присутствия диффузии во фторидной подрешетке стекол I—III выше 450 К может свидетельствовать высокая ионная проводимость этих стекол: $\sigma > 10^{-4}$ См/см при $T \ge 480$ К.

Таким образом, в исследованных ВФЦС с добавками фторидов Sr, Ba и Pb с повышением температуры от 180 до 500 K во фторидной подсистеме наблюдается переход от жесткой решетки к диффузии через промежуточный этап, связанный с реализацией локальных движений. Учитывая, что структура фтороцирконатных стекол, как правило, образована полиэдрами циркония ZrF_n, связанными между собой в слои или цепи [17, 18], можно предположить, что наиболее вероятной формой локальных движений в стеклах в области 350—450 K являются реориентации группировок ZrF_n. Для оценки координационного числа (KЧ) ионов циркония в этих группировках и выяснения роли трифторида висмута в процессах формирования структуры стекол I—VI дополнительно была привлечена ИК и KP спектроскопия, данные которой позволили, например, установить существование полиэдров висмута в составе стекол в системе InF₃—BiF₃—BaF₂ [10, 19].

Известно [20—23], что в колебательных спектрах фтороцирконатных стекол наблюдаются интенсивные полосы в области 600—450 см⁻¹, отвечающие преимущественно валентным колебаниям связей Zr— $F_{\text{конц}}$ в решетке, а в диапазоне 470—350 см⁻¹ регистрируются полосы, соответствующие валентным колебаниям Zr— $F_{\text{мост}}$ группировки Zr F_n .

КР спектры трифторида висмута, структура которого образована 8-координированными полиэдрами Ві, объединенными в каркас [24], характеризуются рядом полос, среди которых наиболее интенсивные пики имеют следующие частоты (рис. 3): 311 (с), 271 (с), 248 (с), отвечают валентным симметричным колебаниям Ві—F, 213 (шир) и 115 (с) см⁻¹ — деформационным и решеточным колебаниям Группировки ВіF₈, которые при сохранении кристаллической структурной единицы в решетке стекла должны отразиться в спектрах. В ИК спектрах полосы

валентных колебаний v_{as} Bi—F расположены в области 455 и 380 см⁻¹ [10, 19]. Валентное полносимметричное колебание v_s Bi—F в области 490 см⁻¹ малоинтенсивно.

Практически одинаковый характер ИК спектров (две интенсивные широкие полосы в области 460—480 и 260—280 см⁻¹, принадлежащие антисимметричным валентным колебаниям v_{ав} Zr—F_{конц} и антисимметричным деформациям группировки ZrF_n соответственно) и ЯМР ¹⁹F спектров (ниже 250 K) стекол **I**—**III**, может свидетельствовать о близости структурных мотивов стекол данного состава. В КР спектрах наблюдается наиболее интенсивная полоса полносимметричного валентного колебания v_s Zr—F_{конц} (v₁) с максимумом в области 500—600 см⁻¹ и заметно плечо 470—480 см⁻¹, интенсивность и положение которых зависит от содержания в стекле фторидов висмута и бария (стронция, свинца) при постоянной концентрации ZrF₄. Учитывая высокочастотное положение v₁ и высокое стехиометрическое отношение (F/Zr > 6), можно предположить, что базовая модель стекол **I**—VI имеет цепочечную структуру, построенную из полиэдров циркония с KЧ, равными 7 и 8, аналогичную решетке кристалла β-BaZrF₆. Остался нерешенным вопрос о роли трифторида висмута в структуре стекол **I**—VI: образуются ли полиэдры висмута и, если да, то каково их место в структуре стекла? Или же трифторид висмута отдает свои атомы фтора фтороцирконатной решетке и входит в состав стекла в виде внешнесферных катионов-модификаторов Bi³⁺?

Как уже отмечалось, спектры ЯМР¹⁹F стекол I—III ниже 250 К состоят по меньшей мере из двух линий, максимумы которых располагаются в области 200 ± 10 и 70 ± 20 м.д. (см. рис. 1). Для корректной интерпретации данных ЯМР был проведен анализ обычных (статических) спектров ЯМР¹⁹F и спектров ЯМР высокого разрешения (записанных с использованием методики MAS [25]; четырехмиллиметровые циркониевые роторы) стекол в системах ZrF_4 —BiF₃— LiF, ZrF_4 —BiF₃—BaF₂, ZrF_4 —BaF₂—NaF и ZrF_4 —BaF₂ с разным содержанием ZrF_4 или BiF₃. При этом для ответа на вопрос о роли трифторида висмута в структуре стекла при разных его концентрациях основной анализ полученных результатов был проведен для стекол в системе $50ZrF_4$ —(50–x)BiF₃—xBaF₂ (стекла IV—VI, см. таблицу) и стекла 5ZrF₄—50BiF₃—45LiF.

Спектр ЯМР ¹⁹F стекла 5ZrF₄—50BiF₃—45LiF при отсутствии локальных движений во фторидной подрешетке состоит из одиночного слабо асимметричного сигнала гауссовой формы с $\delta = 113$ м.д. (220 К), параметры которого близки параметрам резонансной линии в спектре ЯМР ¹⁹F соединения BiF₃ (δ (BiF₃) = 112 м.д., T = 300 K) с KЧ (Bi³⁺) = 8 [24]. Учитывая то, что катионы-модификаторы M^{n+} во фтороцирконатных стеклах своих координационных полиэдров не образуют [4, 17, 19], можно полагать, что эта линия принадлежит группировкам висмута BiF_m . Следовательно, при малой концентрации ZrF_4 (не более 5—10 мол.%) сетку стекол в системах ZrF₄—BiF₃—MF_n формируют полиэдры висмута, аналогичные полиэдрам висмута в кристаллах. Другими словами, висмут в этом случае выступает как стеклообразователь. Данное заключение подтверждается и результатами анализа колебательных спектров этого стекла. В спектре КР наблюдается сдвиг полос, отвечающих за v_s Bi—F, в высокочастотную область $(311 \rightarrow 345, 272 \rightarrow 290, 248 \rightarrow 270 \text{ см}^{-1})$, что может быть связано с упрочнением связи Bi—F и, вероятнее всего, понижением КЧ иона Bi³⁺. При этом в КР спектре данного стекла уже при такой небольшой концентрации ZrF4 (5 мол.%) отчетливо проявляются полосы в области ~534 см⁻¹ (v_s Zr— $F_{конц}$), ~460 см⁻¹ (v_{as} Zr— $F_{конц}$) и связанная с симметричными решеточными движениями самих группировок ZrF_n полоса ~159 см⁻¹. Таким образом, наряду с полиздрами висмута в структуре стекла 5ZrF₄—50BiF₃—45LiF уже при небольших концентрациях ZrF₄ заметно присутствие и группировок ZrF_n. Кроме того, по низкочастотному сдвигу полносимметричной моды валентного колебания в КР спектре можно предположить наличие мостиков Bi—F—Zr в решетке стекла и считать ZrF₄ вторым стеклообразователем.

С увеличением содержания ZrF₄ характер спектров ЯМР ¹⁹F рассматриваемых ВФЦС несколько изменяется, и при определенных концентрациях тетрафторида циркония (\geq 45 мол.%) форма линии в отсутствие ионных движений с частотой выше 10⁴ Гц уже практически не зависит от состава стекла (см. рис. 1 и 2). Спектр ЯМР ¹⁹F бинарного стекла 60ZrF₄—40BaF₂ имеет форму, аналогичную форме спектров ЯМР стекла 50ZrF₄—30BaF₂—20NaF и стекол в тройной





Рис. 2. Температурная трансформация спектров ЯМР 19 F стекол в системе 50 ZrF₄—(50–*x*) BiF₃—*x* BaF₂ при разной концентрации фторидов висмута и бария

Рис. 3. КР спектры стекол: 60 ZrF₄—40 BaF₂ (1), 50 ZrF₄—10 BiF₃—40 BaF₂ (2), 50 ZrF₄— 40 BiF₃—10 BaF₂ (4) и кристалла BiF₃ (3)

системе ZrF₄—BiF₃—BaF₂. Наблюдаемый как минимум двухкомпонентный спектр ЯМР свидетельствует о структурной неоднородности фторидной подрешетки рассматриваемых стекол, что следует из анализа спектров MAS ЯМР ¹⁹ F. И хотя используемая частота вращения образца $(10 \rightarrow 18 \text{ к}\Gamma\mu)$ недостаточна для полного разрешения спектра ЯМР исследуемых стекол в поле 7,05 T, тем не менее, удается выделить две компоненты с изотропными XC (δ_{iso}) 173 и 139, 175 и 141, 167 и 145 м.д. для стекол 60ZrF₄—40BaF₂, 50ZrF₄—10BiF₃—40BaF₂ и 50ZrF₄—40BiF₃— 10ВаF₂ соответственно. Использование более высокой частоты вращения образца (до 30 кГц) для стекол (100–*x*) ZrF_4 —*x*BaF₂ (22 $\leq x \leq 42$ мол.%) в поле 4.7 Т позволило авторам [26] получить спектры высокого разрешения и выделить компоненты, отвечающие определенным позициям атомов фтора в структуре стекла. Компьютерная симуляция показала, что спектр MAS ЯМР ¹⁹F стекла 58ZrF₄—42BaF₂ (как впрочем, и других стекол в этой системе) при комнатной температуре можно представить тремя гауссовыми компонентами с XC 209, 181 и 146 м.д. с отношением интенсивностей линий, равным 26:45:29. Вариация состава стекла изменяет в спектре в основном положение первой компоненты (δ_{iso} pacter от 209 до 242 м.д. при увеличении концентрации ZrF₄ от 58 до 78 мол.%) и не затрагивает ее интенсивности. В то же время происходит рост интенсивности основной компоненты (от 45 до 72 %) и уменьшение интенсивности третьей компоненты до 4 %. Анализ поведения ХС линий и их интенсивностей в спектрах MAS ЯМР ¹⁹F кристаллических фтороцирконатов и барийфтороцирконатных стекол указывает на существование мостиковых атомов фтора типа Zr—F_{мост}—Zr, которым отвечает компонента с XC ≈ 180 м.д., и двух типов концевых атомов фтора Zr—F_{кони}, один из которых образует связь Zr—F_{конц}—Ва (компонента с δ_{iso} ≈ 145 м.д.), а другой связывает атом Zr с двумя атомами бария.

Найденные нами значения δ_{iso} двух компонент в спектрах MAS ЯМР ¹⁹F исследуемых стекол сопоставимы с величиной XC линий в спектрах MAS ЯМР ¹⁹F стекол (100–*x*)ZrF₄—*x*BaF₂ (22 $\leq x \leq$ 42 мол.%). К сожалению, нам не удалось определить изотропный химический сдвиг третьей компоненты, хотя характер формы статических спектров не исключает ее присутствия. Учитывая данные изложенного выше анализа и сравнивая параметры спектров ЯМР стекол в системах ZrF₄—BaF₂, ZrF₄—BaF₂—NaF и ZrF₄—BiF₃—BaF₂ при различных концентрациях соответствующих фторидов, можно утверждать, что компонента с $\delta_{iso} \approx 173\pm5$ м.д. принадлежит мостиковым атомам фтора Zr—F_{мост}—Zr в полиэдрах ZrF_n (*n* = 7, 8). Компоненту с XC \approx ≈ 142±3 м.д., по-видимому, следует отнести к концевым атомам фтора в циркониевом полиэдре, которые, вероятнее всего, связаны с атомом бария либо висмута, поскольку замена ионов бария ионами висмута практически не отражается на ХС этой линии. Данные ЯМР ¹⁹F для стекол, содержащих не менее 45 мол.% ZrF₄, не дают однозначного ответа на вопрос, присутствуют ли в структуре рассматриваемых стекол фторсодержащие полиэдры висмута. Для разрешения этой проблемы были привлечены данные ИК и КР спектроскопии.

Как уже отмечалось выше, данные колебательной спектроскопии указывают на присутствие полиэдров ZrF_n в структуре стекол I—VI. При этом, согласно предполагаемой корреляции между частотой полносимметричного валентного колебания Zr—F (область 600—500 см⁻¹) в КР спектрах и значением КЧ иона циркония [18, 23] и учитывая высокое молярное отношение F/Zr > 6, можно полагать, что структура стекол IV—VI содержит в основном полиэдры Zr с КЧ 8, связанные мостиковыми связями. Наличие интенсивной полосы 397 см⁻¹ (v_s Zr—F_{мост}) также подтверждает существование в решетке мостиковых связей, которым в спектрах ЯМР ¹⁹F отвечает компонента с XC ≈ 173±5 м.д. При этом в ИК спектрах стекол I—VI нет отдельных полос, которые могли бы принадлежать фторвисмутовым группировкам. С другой стороны, в спектре КР стекла VI (F/Zr = 6,2) регистрируют три полосы с максимумами 165, 397 и 581 см⁻¹ (см. рис. 3), положение которых в спектре незначительно зависит от содержания трифторида висмута. При увеличении концентрации BiF_3 от $10 \rightarrow 40$ мол.% значения этих частот составляют 162, 398 и 590 см⁻¹. Одновременно наблюдается заметное размывание первых двух полос, увеличение относительной интегральной интенсивности полосы, соответствующей колебаниям Zr—F_{мост}, и значительное снижение интенсивности третьей полосы. Однако новых полос в спектрах КР не появляется. Уменьшение интенсивности полосы 580—590 см⁻¹ можно объяснить снижением количества связей Ва-F_{конп}-Zr в структуре стекла. Незначительный сдвиг, увеличение интегральной интенсивности и размывание полос в области мостиковых колебаний свидетельствуют об образовании связей Bi-F_{конц}-Zr. При этом связь атома Bi с атомами фтора фтороцирконатной решетки менее слабая, чем в трифториде висмута, так как характерных для кристалла BiF₃ полос в спектре не появилось. Таким образом, наблюдаемый колебательный спектр стекол V и VI можно полностью сопоставить колебательным модам фтороцирконатной решетки.

Учитывая эти и вышеизложенные данные, можно предположить, что способность циркония образовывать более прочные связи Zr—F и относительно высокое содержание тетрафторида циркония в стеклах (45—50 мол.%) в системах ZrF₄—BiF₃—MF₂ (F/Zr > 6) препятствует образованию собственных полиэдров висмута и участию их в построении сетки стекла. Катионы Bi³⁺ в решетке изучаемых стекол, по-видимому, выступают как "модификаторы", занимая места Ba²⁺ (их ионные радиусы близки), связываясь с фтороцирконатной цепью ионными связями. Другими словами, вероятность образования полиэдров висмута, аналогичных кристаллическим, при концентрациях ZrF₄ выше 45 мол.% незначительна. Тем не менее при концентрациях ZrF₄ менее 10 мол.% и BiF₃ более 35 мол.% присутствие полиэдров BiF_m в стеклах в системах ZrF₄—BiF₃—MF_n, несомненно, имеет место.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Характер ионных движений в стеклах, образующихся в системах ZrF_4 —BiF₃—MF₂ (M = Sr, Ba, Pb), определяется несколькими факторами. При одинаковой концентрации в стекле вводимых добавок (фторидов стронция, бария или свинца) степень связанности различных координационных полиэдров между собой определяет базовую модель структуры ближнего порядка и динамические свойства фторидной подсистемы. С повышением температуры от 220 до 500 K во фторидной подсистеме наблюдается переход от жесткой решетки к диффузии через промежуточный этап, связанный с реализацией локальных движений различных фторсодержащих группировок циркония (висмута), формирующих сетку стекла. Самый низкий интервал температур, в котором развивается этот процесс, характерен для стекла $45ZrF_4$ — $35BiF_3$ — $20PbF_2$, имеющего наименьшее значение T_g по сравнению с другими (аналогичными по составу) стеклами (см. таблицу). Это же стекло имеет наиболее высокую ионную проводимость по сравне-

нию со стеклами $45ZrF_4$ — $35BiF_3$ — $20MF_2$ (M = Ba, Sr). Отмеченные факты, вероятнее всего, обусловлены высокой поляризующей способностью ионов Pb²⁺, что, как известно [16], оказывает положительное влияние на динамику ионов фтора, которые в ВФЦС осуществляют ионный транспорт.

Согласно предварительным данным электрофизических измерений, фторидные стекла в системах ZrF₄—BiF₃—MF₂ обладают высокой ионной проводимостью (см. таблицу) и, следовательно, могут быть использованы при создании функциональных материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 08-03-00355).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Kahnt H. // J. Non-Cryst. Solids. 1996. 203. P. 225 231.
- 2. Aniya M. // Solid State Ion. 2000. 136-137. P. 1085 1089.
- 3. Сорокин Н.И. // Успехи химии. 2001. 70. С. 901 908.
- 4. Lucas J. // J. Fluor. Chem. 1995. 72. P. 177 181.
- 5. *Федоров П.П.* // Неорган. материалы. 1997. **33**. С. 1415 1424.
- 6. Deit C., Poulain M. // J. Non-Cryst. Solids. 1997. 213&214. P. 49 54.
- 7. Stamboulis A., Hill R.G., Law R.V. // J. Non-Cryst. Solids. 2005. 251. P. 3289 3295.
- 8. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Логовеев Н.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2008. 53. С. 467 473.
- 9. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Синебрюхов С.Л. и др. // Неорган. материалы. 2009. **45**. С. 358 365.
- 10. Кавун В.Я., Меркулов Е.Б., Гончарук В.К., Игнатьева Л.Н. // Физ. и хим. стекла. 2000. **26**. С. 414 419.
- 11. *Кавун В.Я., Сорокин Н.И., Меркулов Е.Б., Гончарук В.К.* // Неорган. материалы. 2001. **36**. С. 1008 1010.
- 12. Меркулов Е.Б., Логинов Н.А., Гончарук В.К., Ярошенко Р.М. // Физ. и хим. стекла. 2007. **33**. С. 149 154.
- 13. Merkulov E.B., Goncharuk V.K., Logoveev N.A. et al. // J. Non-Cryst. Solids. 2005. 351. P. 3607 3609.
- 14. Лундин А.Г., Федин Э.И. ЯМР спектроскопия. М.: Наука, 1986.
- 15. Габуда С.П., Гагаринский Ю.В., Полищук С.А. ЯМР в неорганических фторидах. М.: Атомиздат, 1978.
- 16. Бузник В.М. Ядерная спектроскопия неорганических фторидов. Владивосток: Дальнаука, 1997.
- 17. Кавун В.Я., Сергиенко В.И. Диффузионная подвижность и ионный транспорт в кристаллических и аморфных фторидах элементов IV группы и сурьмы(III). Владивосток: Дальнаука, 2004.
- 18. Войт Е.И., Войт А.В., Сергиенко В.И. // Физ. и хим. стекла. 2001. 27. С. 298 311.
- 19. Игнатьева Л.Н., Меркулов Е.Б., Стремоусова Е.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2006. **51**. С. 1744 1748.
- 20. Phifer C.C., Gosztola D.J., Kieffer J., Angell C.A. // J. Chem. Phys. 1991. 94. P. 3439 3450.
- 21. Walraffen G.E., Hokmabadi M.S., Guha S., Krishnan P.N. // J. Chem. Phys. 1985. 83. P. 4427 4443.
- 22. Kawamoto Y., Sakaguchi F. // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1983. 56. P. 2138 2141.
- 23. Войт А.В., Войт Е.И., Сергиенко В.И. // Физ. и хим. стекла. 2001. 27. С. 298 311.
- 24. Уэллс А. Структурная неорганическая химия. Т. 2. М.: Мир, 1987.
- 25. Хеберлен У., Меринг М. ЯМР высокого разрешения в твердых телах. М.: Мир, 1980.
- 26. Youngman R.E., Sen S. // Solid State NMR. 2005. 27. P. 77 89.

902